

DRK-G302 颗粒图像分析仪



【产品介绍】

DRK-G302 型颗粒图像分析仪将传统的测量方法与现代的图像技术相结合，是一种采用图像法进行颗粒形貌分析和粒度测量的颗粒分析系统，由光学显微镜、数字 CCD 摄像机和颗粒图像处理分析软件组成。该系统通过专用的数字摄像机将颗粒在显微镜下的图像拍摄下来传输给电脑，通过专用的颗粒图像处理分析软件对图像进行处理分析，具有直观、形象、准确和测试范围宽等特点。可以观察颗粒形貌，也可得到粒度分布等分析结果。

DRK-G302 型颗粒图像分析仪融合了当今先进的图像处理和分析技术，产品设计符合国际标准 ISO-13322-1, 可完成几十项颗粒几何形态学的参数测量和图像几何形状的测量。软件同时配备专用的数据报表，可直接按颗粒的粒径面积、形状等多类参数，以线性或非线性统计方式绘出分布图。

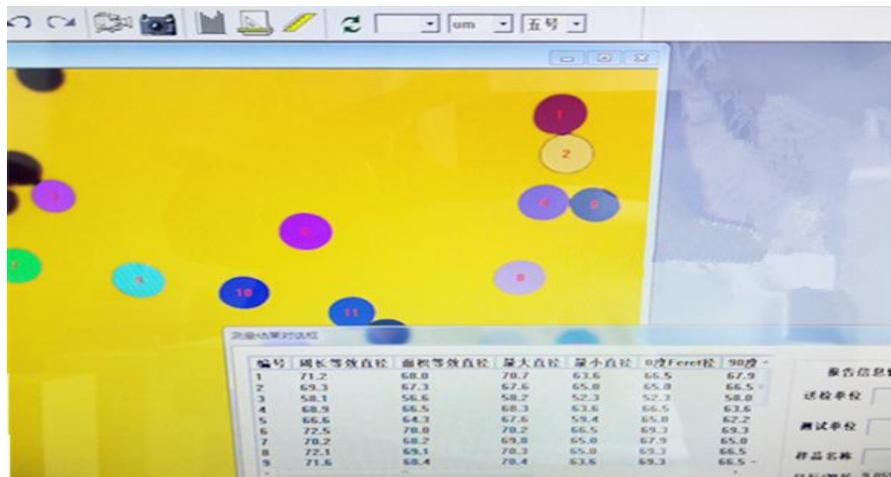
【技术参数】

- 1.量程范围：0.5~3000 μm ；
- 2.放大倍数：>5000 倍。
- 3.显微镜：光学显微镜
- 4.最大分辨率：0.1 μm /像素；
- 5.重复性误差：<1%；
- 6.数字摄像机（CCD）：500 万像素，摄像头密闭在壳体内，具有防污染功能，并且保障了接口安全稳定性。；
- 7.自动分割速度： \leq 1 秒；
- 8.分割成功率： \geq 97%；
- 9.干粉分散器（选配）。

【应用范围】

适用于磨料、涂料、非金属矿、化学试剂、粉尘、填料等各种粉末颗粒的粒度测量、形貌观察和分析。

【软件功能】



- 1、可以对图像进行多种处理。如：影像增强、图像叠加、局部提取、定倍

放大、对比度、亮度调节等几十种功能

2、 具有圆度、曲线、周长、面积、直径等几十种几何参数的基本测量

3、 可直接按颗粒粒径的粒径面积、形状等多类参数，以线性或非线性统计方式绘出分布图

数据输出：

周长分布、面积分布、长径分布、短径分布、周长相当径分布、面积相当径分布、Feret 径分布、圆度、中间径 (D50)、有效粒径 (D10)、限定粒径 (D60)、D30、D97、个数长度平均径、个数面积平均径、个数体积平均径、长度面积平均径、长度体积平均径、面积体积平均径、不均匀系数、曲率系数。

【技术支持】

全面的技术培训和内容详尽的使用操作说明书、软件在线帮助使操作人员能准确操作、解决疑问、排除故障。

根据样品的密度、粒度、流动性、团聚性、溶解性和物理化学反应等理化特性，我们总结出了一套科学、系统和完整的分散测试方案，随着仪器提供给用户。我们既销售仪器，又提供分散测试方案。

注：因技术进步更改资料，恕不另行通知，产品以后期实物为准。